

Model AE-3245A 5 分類數位 C-tan δ 量測儀

最適合檢查鋁質電解電容質、的老化現象

特 徵

- 接觸量測功能基本配備
- 測量頻率：120Hz [正弦波形]
- 測量時間：約 105msec.[包含接觸&殘留電壓量測時間]
- 測量範圍：C[0~39.99mF] / tan δ 0 ~ 199.9%]
- 以內建比較器功能顯示 5 分類判定及輸出
- Centronics 輸出標準配備



Model AE-3245A 5 分類數位 C-tanδ 量測儀

SPECIFICATIONS

測量範圍及基本精確度 適用於 C:200(digit)~3999(digit)/tanδ <99.9% (周圍溫度 23°C±5°C)

檔位	400nF	4μF	40μF	400μF	4mF	40mF
C 精確度	±0.5%±2(digit)				±2%±2(digit)	±2%±5(digit)
tanδ 精確度	± $\left[\frac{\tan\delta(\text{digit}) \times 0.3}{100} + 2 + \frac{2000}{C \text{ 表示(digit)}} \right]$ digit					± $\left[\frac{\tan\delta(\text{digit})}{100} + 5 + \frac{2000}{C \text{ 表示(digit)}} \right]$ digit
測量模式	串聯等效電路					

※tanδ 為 100.0%~199.9%的情況 C 以及 tanδ 的精確度則為上記之 2 倍。

測量模式	串聯等效電路
測量訊號等級	約 400mV (r.m.s.) 以下
測量方式	由電壓、電流、遮護線端所構成之 5 點端子
測量頻率	120Hz±0.1%、正弦波
測定端子	前面板部：接線柱 5 點端子 後面板部：8P 圓形金屬電路連接器
接觸檢測	以輸入端子的 1 點端子上進行量測而接觸電阻為約 200Ω 以上時為量測錯誤
殘留電壓檢測	以 4 點端子連結時，檢測測量樣品未放電電壓為約 2.2V 以上則保護測量電路（保護輸入）
測量時間	【HOLD 模式測量時間】約 105msec. 【測量量測&確認殘餘電壓】約 27msec. 【測量安定時間】約 45msec. 【到達測量端子開放時間】約 96msec. 【內部觸發模式測量時間】約 3 回/秒
判定結果顯示	容量[C]：CLO、CLG、CGO、CHG、CHI tanδ：DGO、DNG
判定結果外部輸出	GO1、GO2、CNG、DNG
控制訊號	輸出：START、HOLD、RESET、CINH、SHIFT、NINH、GINH 輸入：GO1、GO2、CNG、DNG、CER、COV、DER、DOV、CEND、MEND、BUSY、SLCT、CCE、VCE、各種切換判定
檔案介面	Centronics 輸出
使用周圍環境	溫度：0°C~+40°C、濕度：80%以下（不結霜情況下）
所需電源	AC85V~265V、50~60Hz、約 45VA
外形尺寸	432(W)×149(H)×450(D)mm（不含底部橡膠部分。）
重量	約 10kg

○型錄的規格會因機台改良而隨時變更。

AEMIC 株式会社

〒612-8448

京都市伏見區竹田東小屋ノ内町 34 番地

電話: +85-75-612-0710 FAX: +85-75-612-0750

E-Mail: sales@ae-mic.com

http://www.ae-mic.com